

## 附錄一、粒狀污染物不透光率監測設施之規範

(一) 規範內容：粒狀污染物不透光率監測設施之安裝規範、監測設施確認程序、零點偏移及全幅偏移測試程序、測試查核程序、性能規格、校正器材品保規範及公式等。

### (二) 名詞定義

1. 粒狀污染物不透光率監測設施：指可連續自動監測排放管道排氣不透光率之整體設備，包括：

(1) 採樣界面(Sample Interface)：指保護監測設施的分析儀，使之不受排放管道排放污染物的影響，有助保持光學表面清潔之界面。

(2) 污染物分析器(Pollutant Analyzer)：指感應排放氣體不透光率並輸出訊號之儀器。

(3) 數據記錄器(Data Recorder)：指持續記錄分析器輸出不透光率之訊號，並具有自動整理數據功能及可供電腦連線傳輸介面之儀器。

2. 透光儀(Transmission Meter)：指監測設施之一部分，包括採樣界面及分析器。

3. 透光率(Transmittance, Tr)：指入射光線通過介質之百分率。

4. 不透光率(Opacity, Op)：指入射光線經過介質而衰減之百分率。

5. 尖峰光譜應答(Peak Spectral Response)：指透光儀光譜應答曲線上最大的光譜應答值。該值即為透光儀最大靈敏度相對之波長。

6. 平均光譜應答(Mean Spectral Response)：指透光儀有效光譜應答曲線上所有光譜應答值之算術平均值。

7. 檢視角度(Angle of View)：指由分析儀之光學偵測器，所檢視出之最大輻射角度，輻射強度應大於2.5%尖峰光譜應答值。

8. 投射角度(Angle of Projection)：指由分析儀燈泡組投射出之最大輻射角度，輻射強度應大於2.5%尖峰光譜應答值。

9. 校正誤差(Calibration Error)：指監測設施量測不透光率值及校正衰光器不透光率讀數之差。

10. 應答時間(Response Time)：指監測設施接收到校正標準氣體或

校正器材產生訊號變化後，至記錄器顯示訊號達到最終數值95%時之完整採樣、測量與記錄循環所需要之時間。

11.操作測試期間(Operational Test Period)：指不進行維修及調整狀況下，依操作規範操作執行監測設施確認程序之期間。

12.光徑長度(Path Length)：指介於接受器至單向透光儀(Single-pass Transmission Meter)間或透光接受器(Transceiver)至雙向透光儀(Double-pass Transmission Meter)之反射器間光柱所經過之距離。

二種光徑長度定義如下：

(1)監測光徑長度(Monitor Path Length)：指監測設施安裝位置之光徑長度。

(2)排放口光徑長度(Emission Outlet Path Length)：指排放管道出口處之光徑長度。其排放口若為非圓型，光徑長度計算方式如公式1-1，但不適用逸散性之壓力濾袋出口及側面排放閘口等。

13.儀器輸出讀值：指進行校正誤差查核、系統應答時間測試、零點偏移及全幅偏移測試或標準氣體查核等測試時，未經調整之監測設施顯示值。

14.分析儀器模擬值：指使用標準電位訊號產生器，以電壓或電流訊號，輸入訊號傳輸系統所得之數值。

### (三) 安裝規範

1.採樣位置：監測設施採樣位置應設置於足以取得具代表性數據之位置，其設置要求如下：

(1)在所有粒狀污染物控制設備之下游位置。

(2)不得在水汽會凝結之位置。

(3)不受周遭光線干擾之位置。

(4)在容易進行維修、保養或操作之位置。

(5)既存固定污染源因採行濕式洗滌污染防制設備，致監測設施無法準確量測者，得報經直轄市、縣（市）主管機關同意後，設置於濕式洗滌污染防制設備之上游位置。

2.量測光徑安裝位置：量測光徑須選擇在排放氣體混合良好及濃度

均勻之位置，混合良好之要素包括紊流混合及足夠之混合時間。量測光徑應通過占排放管道截面積25%之中央區域內（與排放管道截面幾何相似形之同心區域）。但符合以下情形之一者，量測光徑位置應依下述規定辦理：

- (1)透光儀位置在彎曲道下游排放管道垂直段四倍直徑距離以內，其量測光徑須位於該彎曲道中心曲線所在之平面上，如圖一。
  - (2)透光儀位置在彎曲道上游排放管道垂直段四倍直徑距離以內，其量測光徑須位於該彎曲道中心曲線所在之平面上，如圖二。
  - (3)透光儀位置在一個彎曲道下游排放管道垂直段四倍直徑距離以內，並在另一個彎曲道上游一倍直徑距離以內，其量測光徑須位於其上游彎曲道中心曲線所在之平面上，如圖三。
  - (4)透光儀位置在垂直彎曲道下游排放管道水平段四倍直徑距離以外者，其量測光徑須位於距離下端管壁 $1/2$ 至 $1/3$ 直徑範圍內之水平面上，如圖四。
  - (5)透光儀位置在垂直彎曲道下游排放管道水平段四倍直徑距離以內，若排放氣體為向上流者，其量測光徑須位於距離上端管壁 $1/2$ 至 $1/3$ 直徑範圍內之水平面上；排放氣體為向下流者，量測光徑須位於距離下端管壁 $1/2$ 至 $1/3$ 直徑範圍內之水平面上，如圖五。
- 3.無法於前述1或2規定位置裝設監測設施之污染源，經報請直轄市、縣（市）主管機關同意後，得選擇替代位置，該替代位置與前述規定位置所得之不透光徑平均值，其誤差應小於10%，或在二位置所測得之不透光率差值小於不透光率值2%，或得報經直轄市、縣（市）主管機關同意替代設置粒狀污染物重量濃度監測設施，以監測排放管道之粒狀污染物排放情形。

#### 4.透光儀

- (1)尖峰及平均光譜應答：光波長必須在400 nm 至700 nm 之間，任何波長小於400 nm 或大於700 nm 的應答強度不得大於尖峰光譜應答10%。
- (2)檢視角度：檢視角度必須小於5度。

(3)投射角度：總投射角度必須小於5度。

(4)光學準線(Optical Alignment Sight)：每一分析器需具有光學準線對準之檢查方法，該方法於八公尺之光徑，若光學準線未對準，可感應 $\pm 2\%$ 不透光率之變化。若分析儀器在實際操作中可自動檢查零點，且其量測及校正時光學準線維持不變，則無須符合上述規定。

(5)模擬零點及全幅校正系統：偏移測試必須檢查零點及全幅二點，此二點若無法校正，則須報經直轄市、縣（市）主管機關同意後以低值（10%以下不透光率值）及高值（全幅之80至100%）二點取代之。每一分析器必須具備校正系統，模擬零點及全幅不透光率值，以提供透光儀在操作中之零點偏移及全幅偏移測試，該校正系統可用來檢查分析器內部之光學參數、燈泡及光感應器等電子電路。

(6)外部光學表面之清潔：每一分析器之光學表面必須能夠在不移動監測設施及不需重新校正光學準線之情況下進行清潔工作。

(7)自動零點補整(Compensation)指示器：

A 監測設施之光學表面受灰塵污染後，透光儀應具備零點補整功能，在補整累積超過4%不透光率時，可在指示器上顯示出。該指示器應位於方便操作之位置，並應以自動控制或手動方式記錄每二十四小時之零點補整，以決定其二十四小時零點偏移。

B 具有自動校正功能者，於零點補整累積至4%不透光率時，應清潔光學感應之表面；不具自動校正功能者，在零點偏移及全幅偏移測試前，應清潔光學感應之表面。

(8)光源：排放管道監測用之光源應與（四）監測設施確認程序、（五）零點偏移及全幅偏移測試程序及（六）測試查核程序執行校正測試或查核之光源相同。

5.數據記錄器：數據記錄器應答範圍須包含零點至量測範圍，其量測設定範圍應配合污染物分析器之量測範圍，並應能調整至污染

物分析器偵測極限濃度之刻度。

- 6.校正衰光器(Calibration Attenuators)：校正衰光器必須為中性光譜特性之濾光器或篩光器，校正誤差查核用校正衰光器要有三個以上，其規範及校正程序如下述（四）、2、(2)、B及（八）。

#### （四）監測設施確認程序

##### 1.設備規格確認程序

- (1)光譜應答：由儀器製造商取得偵測器應答(Detector Response)、光源照射率(Lamp Emissivity)及濾光器透光率(Filter Transmittance)之規格資料，並以透光儀製作波長與光譜應答之關係校正曲線，從該曲線上決定尖峰光譜應答波長、平均光譜應答波長及低於400 nm和高於700 nm之最大應答（以尖峰應答百分率表示）。
- (2)檢視角度：依儀器說明書設定接收器(Receiver)，畫一個半徑三公尺的水平圓弧，在圓弧上距接收器中心線二側三十公分範圍內，以每次五公分間隔，測定接收器對不定向光源（小於三公分）之應答強度。在垂直方向重複上述步驟，並計算水平與垂直方向各檢視角度下之應答，製作檢視角度與應答之關係曲線（半徑三公尺之圓弧，弧長二十六公分之夾角為五度）。
- (3)投射角度：依製造商提供之手冊設定投射器，在水平方向畫一個半徑三公尺之圓弧，在圓弧上距投射器中心線兩側三十公分之範圍內，每次五公分間隔，以光電偵測儀（小於三公分）測定光線強度；在垂直方向依同一方法量測，並計算水平與垂直二方向各投射角之應答，製作投射角與應答之關係曲線，進而得到投射角度（半徑三公尺之圓弧，弧長二十六公分之夾角為五度）。
- (4)光學準線：依儀器說明書進行監測設施組合後，將量測光徑設定八公尺，在此光徑中插入一個10%衰光器，緩慢轉動投射器(Projector)，直到記錄器上得到 $\pm 2\%$ 不透光率之變化，再依儀器說明書之指示檢查該儀器是否偏移。

## 2. 性能規格確認程序

(1) 監測設施執行操作測試前，應配合直轄市、縣（市）主管機關完成數據採擷及處理系統備份封存作業，並向直轄市、縣（市）主管機關提交二份備份資料，公私場所與軟體供應商分別自行留存一份備份資料備查。監測設施經操作測試後如需修正數據採擷及處理系統者，應再重新執行本封存作業及操作測試程序。

(2) 先期調整及測試：在安裝監測設施於排放管道之前，應於相關設施上或實驗室中進行此項測試。

### A 裝置準備

- a 依製造商提供之說明書裝設監測設施之量測光徑位置並校正之。
- b 校正前必須實際量測透光器至接收器或反射器間之距離。
- c 監測設施若有自動調整量測光徑長度功能，則依說明書將分析器之輸出訊號調至排放口光徑長度。
- d 設定儀器與數據記錄器之量測範圍（零點及全幅）。
- e 在模擬光徑上進行零點偏移及全幅偏移測試，並調整儀器方位至最大應答值產生。
- f 依儀器說明書指示，在模擬光徑上檢查模擬零點與實際零點是否相符，再量測全幅校正衰光器，並記錄全幅不透光率值，該不透光率量測範圍必須大於排放標準值。

### B 校正衰光器之選擇

- a 公私場所應以粒狀污染物不透光率排放標準值為基準，利用表1-1選擇三個以上校正誤差查核用校正衰光器（低、中、高範圍），及依據表11-3規定選擇全幅偏移測試使用之全幅校正衰光器；當監測光徑長度(L1)不等於排放口光徑長度(L2)者，應利用公式1-2a 計算 L1光徑之校正衰光器不透光率值(OP<sub>1</sub>)。高範圍校正衰光器之不透光率應低於監測設施之量測範圍最大值。
- b 公私場所之粒狀污染物不透光率排放標準值為20%，且

近四季排氣之不透光率月平均值低於10%者，得檢具相關證明資料，報經直轄市、縣（市）主管機關核可，選用表1-1排放標準<20%級距之校正衰光器，並應載明於監測設施確認報告書中。

表1-1 校正誤差查核用校正衰光器規範標準表

粒狀污染物不透光率排放標準值	校正衰光器之不透光率， $OP_2$		
	低範圍	中範圍	高範圍
排放標準<20%	$5\% \leq OP_2 < 10\%$	$10\% \leq OP_2 < 20\%$	$20\% \leq OP_2 < 40\%$
排放標準 $\geq 20\%$	$10\% \leq OP_2 < 20\%$	$20\% \leq OP_2 < 30\%$	$30\% \leq OP_2 < 60\%$

#### C 校正誤差查核

- 將校正衰光器（低、中、高範圍）置入透光儀量測光徑之中間位置，該校正衰光器必須置於量測煙流濃度之一點。
- 在校正衰光器插入後，須確定整束光柱通過校正衰光器時不受到任何反射光之干擾。
- 以三個校正衰光器（低、中、高範圍）量測監測設施輸出之不透光率值，每一個校正衰光器取五次非連續量測讀數並記錄之，共可得到十五個數據。
- 將每個校正衰光器量測五次之數據，分別減去校正衰光器之不透光率值，即為不透光率差值；若光徑須經修正，則先利用（九）之公式1-2修正儀器輸出讀值與校正衰光器之不透光率值，再利用此修正值計算不透光率差值。
- 計算上述不透光率差值之算術平均值、標準偏差及信賴係數（公式1-3、1-4及1-5），並以公式1-6計算差值算術平均值之絕對值及信賴係數絕對值之和，即為校正誤差。

D 系統應答時間測試：將高值之校正衰光器置入透光儀光徑五次，記錄儀器輸出讀值達到校正衰光器真實值95%之時間，再以低值校正衰光器同樣記錄五次，計算上述十次記錄之平均值。

(3)實地調整：依製造商提供之操作指引及（三）規定，將監測

設施安裝於污染設備下游排放管道上。污染源相關設備未操作前，依製造商提供之操作指引，將透光儀之投射光柱對準光偵測器或反射器，以光學準線來確認其對準情況。依（四）、2、(2)、A 規定，在無排放狀況下之排放管道中確認模擬零點及真實零點是否符合，於必要時調整其零點準線。污染源相關設備開機後且排放氣體達到正常操作溫度時，再檢查其光學準線，若產生偏移則應予調整，須注意排放氣體是否符合排放標準，確定排放氣體符合排放標準之前，應檢查監測輸出訊號之變化。

#### (4)操作測試期間(Operational Test Period)

- A 監測設施經實地調整後，需進行暖機調整，再連續進行一百六十八小時以上之操作測試。但僅涉及監測設施之數據採擷及處理系統汰換作業時，則應連續進行四十八小時以上之操作測試，測試項目為 G 與 H 偏移測試。
- B 此期間固定污染源應維持正常運轉，得包括例行性之固定污染源起火（爐）或停車（爐）運作。污染源為批次操作者，操作測試期間應包含一個以上的污染源完整批次操作。
- C 操作測試期間，除執行零點偏移及全幅偏移測試，監測設施必須分析排放氣體之不透光率值並記錄輸出訊號，及依實際固定污染源運轉狀態及監測設施與數據狀態標示監測數據狀態碼，以確認採樣及分析設施與數據採擷及處理系統之運作，數據計算處理與狀態判定應符合附錄十一規定，監測紀錄應連線傳輸至直轄市、縣（市）主管機關，數據類別及傳輸格式應符合附錄十四至附錄十六規定，且傳輸檔案命名規則應符合測試檔案規定。但連線設施因故無法符合本項規定者，得以光碟片、電子郵件或其他電子儲存媒介，併同監測設施確認報告書提報直轄市、縣（市）主管機關。
- D 此期間監測設施不得進行非例行之保養、修理、調整及任何人為之儀器設定操作，僅可執行儀器自動化之例行作業



(如光學表面清潔、自動零點補整等)，並應作成紀錄；無法作成紀錄者，儀器自動化之例行作業方式應詳載於監測設施確認報告書中，報經直轄市、縣（市）主管機關核可。

E 零點偏移及全幅偏移測試與調整、光學表面清潔及光學準線修正，必須每二十四小時進行一次，進行程序詳如 G 及 H 所述。

F 操作測試期間內若污染源因異常而暫停運轉，於污染源重新起動後，應繼續完成操作測試；若監測設施故障、偏移測試未符合性能規格或不符合前述 D 規定者，於調整修護後應重新進行一次完整操作測試。

#### G 零點偏移測試

a 記錄起始模擬零點之不透光率值，每二十四小時檢查並記錄零點儀器輸出讀值（清潔光學表面及調整前）。

b 零點偏移：待監測數據穩定後，記錄零點偏移測試之儀器輸出讀值與零點校正器材標示值，依公式1-7計算零點偏移值；若光徑須經修正，則先利用（九）之公式1-2修正儀器輸出讀值與校正衰光器之不透光率值，再利用此修正值計算不透光率差值。

c 監測設施若具有自動零點補整功能，在零點補整後方可進行零點校正偏移檢查，並記錄零點補整值做為最後零點值（於此值後加一括號記錄補整後零點之讀數）。

#### H 全幅偏移測試

a 零點偏移測試及調整之後，檢查並記錄模擬全幅校正值。

b 全幅偏移：待監測數據穩定後，記錄全幅偏移測試之儀器輸出讀值與全幅校正器材標示值，依公式1-8計算全幅偏移值；若光徑須經修正，則先利用（九）之公式1-2修正儀器輸出讀值與校正衰光器之不透光率值，再利用此修正值計算不透光率差值。

3. 監測設施無法適用前述確認程序者，得於報經直轄市、縣（市）主管機關核可後，以替代方式進行。不透光率監測設施之設備規

格確認程序及性能規格確認之先期調整與測試，除依上述程序進行外，並得以監測設施原製造商提出之測試證明文件替代。

(五) 零點偏移及全幅偏移測試程序：為檢驗監測設施在量測粒狀污染物不透光率之準確程度，應進行零點偏移及全幅偏移測試，其規定如下：

1. 執行零點偏移及全幅偏移測試前，監測設施不可執行任何之調整。但經測試後未符合（七）性能規格，得進行監測設施之維護，以符合性能規格。
2. 公私場所每日零點偏移及全幅偏移測試應於固定時間執行，實際執行時間與設定執行時間之誤差不得超過前後二小時，並應執行至符合（七）性能規格，始得持續進行監測。監測設施於維護後、拆除安裝完成後、停電復歸後或影響偏移測試執行之不可歸責於己事由排除後，或固定污染源未運轉期間未執行每日例行偏移測試者於固定污染源開始運作後二小時內，應執行零點偏移及全幅偏移測試至符合（七）性能規格，始得進行監測。每日例行零點偏移及全幅偏移測試前，倘因其他原因已依規定完成偏移測試，該日例行偏移測試不須執行。因特殊情形無法依固定時間執行例行偏移測試者，於報經直轄市、縣（市）主管機關核可後，得不受固定時間之限制。
3. 監測設施每次進行零點偏移及全幅偏移測試之儀器輸出讀值、零點及全幅校正器材標示值與零點偏移及全幅偏移測試計算結果均應自動記錄之，並連線傳輸至直轄市、縣（市）主管機關，其數據類別及傳輸格式應符合附錄十五規定。既存監測設施無法符合自動記錄者，應向直轄市、縣（市）主管機關申請核定改善期限，並應於期限屆滿前完成改善，改善期限不得逾中華民國一百十六年一月一日。
4. 零點偏移：依（四）、2、(4)、G、b之步驟執行。
5. 全幅偏移：依（四）、2、(4)、H、b之步驟執行。
6. 零點及全幅二點無法校正時，報經直轄市、縣（市）主管機關同意後，得以低值（全幅之0%以上至20%以下）及高值（全幅之

80%以上至100%以下) 二點取代之。

#### (六) 測試查核程序

1.校正誤差查核程序：以監測設施製造商或認可機構提供之校正衰光器或其他校正器材進行查核，應有三種以上不同不透光率之校正衰光器，並依(四)、2、(2)、C之步驟進行之。

2.訊號採集誤差測試查核程序

##### (1)前置作業

A 受測公私場所應準備排放管道監測設施之儀控電路配置圖，並事先確認與現場電路配置一致。

B 確認現場電路訊號使用為電壓或電流範圍。

C 為避免損及公私場所設備，受測現場電路接線作業得由公私場所人員或其委託之儀器維護人員等執行。

D 訊號產生器每年至少一次應送國家度量衡標準實驗室、經財團法人全國認證基金會(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)或其國際相互承認機構認證之實驗室檢查，檢查電流或電壓誤差絕對值大於0.1%標示電流或電壓時，應重新校正訊號產生器或更換訊號產生器，檢測機構應出具檢查結果之品質證明文件。

(2)輸入標準電位訊號：在檢測期間，使用通過檢驗合格之訊號產生器，產生五組由低至高且平均分散在輸出範圍內的電壓（零至五伏特或零至十伏特）或電流（四至二十毫安培）類比訊號模擬分析儀器之傳輸訊號，輸入公私場所訊號傳輸系統，然後通過數據採擷及處理系統查看即時資料，並根據各監測設施量測範圍，待監測數據穩定後，依公式1-9換算出輸入訊號對應之分析儀器模擬值，與公私場所數據採擷及處理系統顯示之原始數據做比對查核，若監測設施採樣及分析設施之訊號輸出方式為數位輸出，則不需進行標準電位訊號輸入比對。

(3)分析儀器模擬值與數據採擷及處理系統原始數據比對：每組模擬分析儀器之傳輸訊號，分別記錄分析儀器模擬值  $VS_i$  與三

次數據採擷及處理系統原始數據  $VT_{i,1}$ 、 $VT_{i,2}$ 、 $VT_{i,3}$ ，按公式 1-10 計算各組訊號採集誤差  $\Delta V$ 。

### 3. 訊號平行比對測試查核程序

#### (1) 前置作業

A 受測公私場所應準備排放管道監測設施之儀控電路配置圖，並事先確認與現場電路配置一致。

B 確認現場電路訊號使用為電壓或電流範圍。

C 為避免損及公私場所設備，受測現場電路接線作業得由公私場所人員或其委託之儀器維護人員執行。

D 直轄市、縣（市）主管機關或公私場所應確認訊號平行比對設備與監測數據比對之起迄時間、擷取時間與擷取頻率之設定一致性，排放管道粒狀污染物不透光率監測設施之訊號擷取頻率為十秒鐘，每次訊號實際擷取時間與設定擷取時間之誤差不得超過正負二秒；排放管道粒狀污染物重量濃度、氣狀污染物、稀釋氣體、排放流率與廢氣燃燒塔排放流率監測設施之訊號擷取頻率為一分鐘，每次訊號實際擷取時間與設定擷取時間之誤差不得超過正負五秒；量測頻率大於一分鐘之排放管道揮發性有機物監測設施與廢氣燃燒塔廢氣燃燒塔總還原硫、揮發性有機物監測設施之訊號擷取頻率為監測設施最小量測頻率，每次訊號實際擷取時間與設定擷取時間之誤差不得超過正負十秒。訊號擷取時間、擷取頻率及擷取時間誤差無法符合者，得由直轄市、縣（市）主管機關核定之。

(2) 資料收集：利用訊號平行比對設備連接監測設施訊號傳輸電路，直接擷取原始電流或電壓訊號值，資料收集時間應達七日以上。

(3) 收集之原始電流或電壓訊號值依據公式 1-9 計算對應之訊號平行比對擷取數據，產生粒狀污染物不透光率十秒鐘擷取數據、排放管道氣狀污染物、稀釋氣體、排放流率或廢氣燃燒塔排放流率一分鐘擷取數據、排放管道揮發性有機物、廢氣燃燒

塔總還原硫或具顯示總淨熱值之廢氣成分及濃度最小量測頻率擷取數據，並與公私場所相同時段之各項監測項目原始數據進行趨勢比對。

(4)趨勢比對：應以每七日資料收集區間，計算各監測項目之訊號平行比對擷取數據與監測設施原始數據之誤差百分比（公式1-11）及誤差百分比平均值（公式1-12），確認數據是否有偏差過大之情形。

A 第一次資料比對區間應自完成前置作業與查核前品質管制作業後起計，每次資料收集區間應達七日，不足七日之資料不可用於比對計算。

B 資料收集區間內訊號平行比對擷取數據或監測設施原始數據如發生遺失數據情形，或執行(5)、B 每季訊號採集誤差測試期間之數據不納入比對計算。

(5)品質管制

A 訊號平行比對設備裝設前，應針對公私場所監測設施依前述2規定執行訊號採集誤差測試，以掌握監測設施原訊號偏差情形。

B 訊號平行比對設備與監測設施訊號傳輸電路之連接期間，於訊號平行比對測試查核前後，應針對訊號平行比對設備及公私場所監測設施分別執行訊號採集誤差測試；資料收集時間若大於九十天者，應至少每季執行一次訊號平行比對設備及公私場所監測設施之訊號採集誤差測試。

C 訊號採集誤差測試用之訊號產生器應符合（六）、2、(1)、D 規範。前述 B 針對公私場所監測設施執行訊號採集誤差測試結果，僅作為訊號平行比對作業之品質管制判定，不納入第十七條符合性能規格之判定依據。

D 前述 B 訊號採集誤差測試結果超出（七）性能規格時，至前一次執行訊號採集誤差測試期間之訊號平行比對擷取數據，將不納入前述(4)計算，待調整模組並校正後，再重新或接續進行測試查核。

E 監測設施採樣及分析設施之訊號輸出方式為數位輸出者，得不進行本項品質管制作業。

4.影像監視查核程序：指利用影像監視設施透過影像拍攝、錄製或結合影像辨識等影像記錄與處理方式，確認監測設施之運作狀態。

(1)影像監視設施應安裝於可清楚拍攝得監測設施之位置，避免環境物品及人員動線形成遮蔽，安裝位置應提供良好照明及設備電源，並保持監測設施儀器或顯示器畫面為經常開啟。但影像監視設施具紅外線功能者，報經直轄市、縣（市）主管機關同意後，得不設置照明設備。

(2)查核前應確認影像監視設施之影像畫面正確性及清晰度，須為256級（8 bit）以上灰階或彩色影像，影像畫面應標示日期時間；採用影像辨識或其他影像處理方式者，確認辨識或處理結果正確性。確認記錄頻率與設定一致。

(3)影像與資料收集：利用影像監視設施記錄監測設施運作情形，查核期間應維持影像監視設施及影像處理軟體有效運作，檔案應依核定方式完整存檔或連線傳輸至指定地點。

(4)查核期間，影像監視設施或影像處理軟體進行任何保養、修理、調整及儀器設定操作等事項皆應作成紀錄。因故中斷監視時應提報直轄市、縣（市）主管機關，並作成紀錄備查。

（七）性能規格：如表1-2所示。

表1-2 不透光率監測設施之性能規格

項目	規 格
1.校正誤差	$\leq 3\%$ 不透光率（如公式1-6）
2.應答時間	$\leq 10$ 秒
3.零點偏移（24小時）	$-2\%$ 不透光率 $\leq$ 零點偏移值 $\leq 2\%$ 不透光率（如公式1-7）
4.全幅偏移（24小時）	$-2\%$ 不透光率 $\leq$ 全幅偏移值 $\leq 2\%$ 不透光率（如公式1-8）
5.記錄器解析度	$\leq 0.5\%$ 不透光率
6.訊號採集誤差	$\leq 1\%$ （如公式1-10）

7.訊號平行比對誤差百分比平均值	$\leq 1\%$ (如公式1-12)
------------------	----------------------

#### (八) 校正器材品保規範

- 1.校正誤差查核用校正衰光器應每二年至少一次送國家度量衡標準實驗室、經財團法人全國認證基金會(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)或其國際相互承認機構認證之實驗室定期檢查，其檢查濃度與出廠標示濃度之誤差絕對值大於2%不透光率時，應更換校正誤差查核用校正衰光器。穩定性檢查應選擇符合表1-3之校正用光譜儀，校正時之波長間隔應小於200 nm，並在校正誤差查核用校正衰光器不同位置檢查數次，依所有波長檢查結果之算術平均值計算檢查濃度。

表1-3 校正用光譜儀之規範

參 數	規 格
光波長範圍	400~700 nm
偵測角度	$< 10^\circ$
準確度	$< 0.5\%$

- 2.前項校正誤差查核用校正衰光器送實驗室檢查及因故更換期間，得使用備用校正衰光器進行例行校正測試、查核、維護作業，備用校正衰光器使用期間應符合本辦法規範。
- 3.校正器材（校正誤差查核用校正衰光器、零點偏移與全幅偏移測試使用之標準衰光器等）應於有效期限內使用，且下列紀錄文件應保存六年備查：
  - (1)校正器材應由製造商或供應商提供校正器材出廠標示不透光率值、使用方式、儲存方法及保存期限之證明文件，與由檢測機構出具定期檢查結果之校正誤差查核用校正衰光器品質證明文件。製造商或供應商無法提供符合前項1穩定性檢查規定之出廠證明文件者，得於報經直轄市、縣（市）主管機關核可後，以符合規定之證明文件替代。
  - (2)校正器材之使用更換紀錄應包含校正器材製造商、型號、序號、製造日期、有效期限、檢查日期、更換日期、監測項目等內容。

(九) 公式

1. 排放口為非圓型之光徑長度計算：

$$De = \frac{2LW}{(L + W)} \quad (1-1)$$

De：排放口光徑長度

L：出口長度

W：出口寬度

2. 監測光徑長度轉化成排放口光徑長度：當監測光徑長度不等於排放口光徑長度時，以下列公式換算：

(1) 校正衰光器不透光率、校正誤差查核儀器輸出讀值、零點偏移及全幅偏移測試儀器輸出讀值之修正計算，及單程(Single-pass)量測原理之不透光率監測數據修正計算：

$$\log(1 - OP_2) = \left(\frac{L2}{L1}\right) \times \log(1 - OP_1) \quad (1-2a)$$

(2) 雙程(Double-pass)量測原理之不透光率監測數據修正計算：

$$\log(1 - OP_2) = \left(\frac{L2}{2L1}\right) \times \log(1 - OP_1) \quad (1-2b)$$

OP<sub>1</sub>：L1光徑之不透光率監測值，或 L1光徑之校正衰光器不透光率值

OP<sub>2</sub>：L2光徑之不透光率監測值，或表1-1所列校正衰光器或表11-3所列全幅校正衰光器之不透光率值

L1：單程監測光徑長度(Single-pass pathlength at the monitor location)

L2：排放口光徑長度

3. 算術平均之計算：

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1-3)$$

$\bar{X}$ ：調整或校正前後差值平均值

$x_i$ ：各組儀器輸出讀值與校正衰光器標示值之差值，或各組儀器輸出讀值與校正誤差查核用校正衰光器最近一次定期



檢查值之差值。若光徑須經修正者，依公式1-2修正儀器輸出讀值與校正衰光器之不透光率值，利用修正值(OP<sub>2</sub>)計算之

4.標準偏差之計算：

$$Sd = \left[ \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n}}{n-1} \right]^{1/2} \quad (1-4)$$

5.信賴係數：單尾(One-tailed)之2.5%誤差信賴係數

$$CC = t_{0.975} \frac{Sd}{\sqrt{n}} \quad (1-5)$$

CC：信賴係數(Confidence Coefficient)

t<sub>0.975</sub>：t 檢定值（如表1-4）

表1-4 t 值

n	t	n	t	n	t
2	12.706	7	2.447	12	2.201
3	4.303	8	2.365	13	2.179
4	3.182	9	2.306	14	2.160
5	2.776	10	2.262	15	2.145
6	2.571	11	2.228	16	2.131

註：n 為數據組數

6.校正誤差之計算：

$$Er = |\bar{X}| + |CC| \quad (1-6)$$

|\bar{X}|：調整或校正前後差值平均值之絕對值

7.零點偏移及全幅偏移之計算：

$$\text{零點偏移值} = R_{CEM} - R_L \quad (1-7)$$

$$\text{全幅偏移值} = R_{CEM} - R_U \quad (1-8)$$

R<sub>CEM</sub>：儀器輸出讀值

R<sub>L</sub>：零點校正標準氣體標示值或校正器材標示值

R<sub>U</sub>：全幅校正標準氣體標示值或校正器材標示值

若光徑須經修正者，依公式1-2修正儀器輸出讀值與校正衰光器之不透光率值，利用修正值(OP<sub>2</sub>)計算之

8.訊號採集誤差之計算：

分析儀器模擬值或訊號平行比對擷取數據

$$= \text{監測設施量測範圍} \times \frac{\text{輸入電壓或電流值} - (0 \text{伏特或} 4 \text{毫安培})}{(5 \text{或} 10 \text{伏特或} 20 \text{毫安培}) - (0 \text{伏特或} 4 \text{毫安培})} \quad (1-9)$$

$$\Delta V(\text{訊號採集誤差}) = \left| \frac{(VT_{i,1} + VT_{i,2} + VT_{i,3}) - 3VS_i}{3M} \right| \times 100\% \quad (1-10)$$

M：監測設施的量測範圍

VT<sub>i,1</sub>、VT<sub>i,2</sub>、VT<sub>i,3</sub>：各組數據採擷及處理系統之原始數據

VS<sub>i</sub>：各組分析儀器模擬值或訊號平行比對擷取數據

9.訊號平行比對之誤差百分比平均值之計算：

$$\text{誤差百分比}(L) = \frac{\text{平行比對擷取數據} - \text{監測設施原始數據}}{M} \times 100\% \quad (1-11)$$

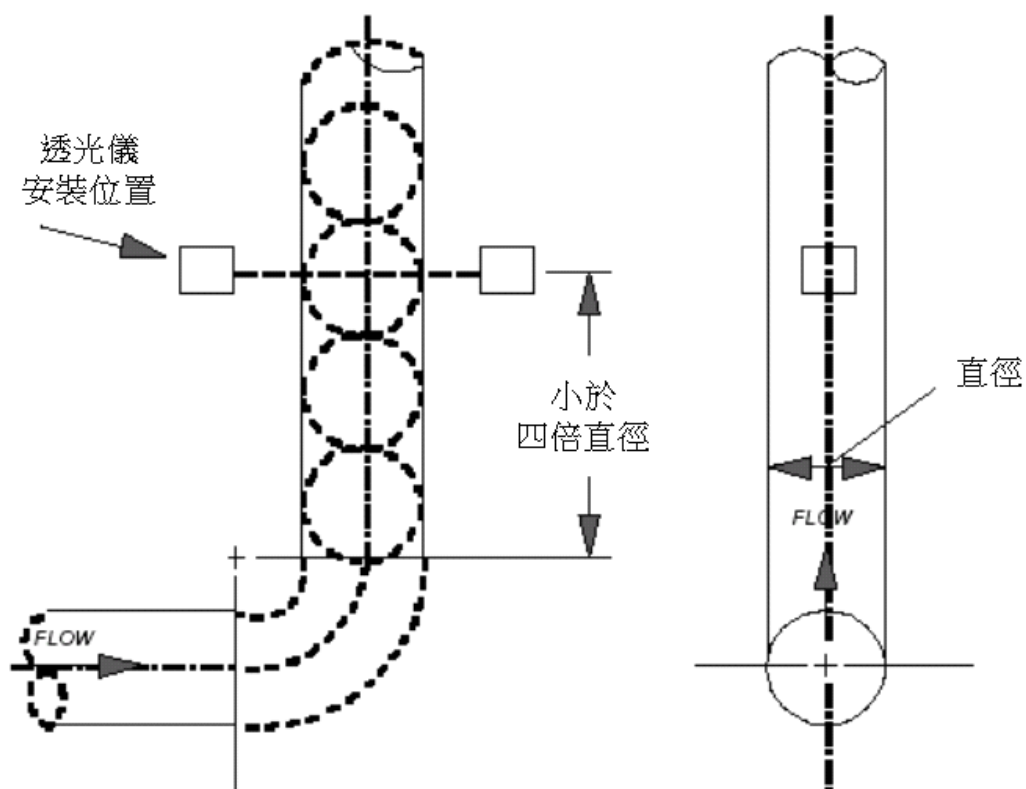
$$\text{誤差百分比平均值}(\bar{L}) = \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L_i \right| \quad (1-12)$$

M：監測設施的量測範圍

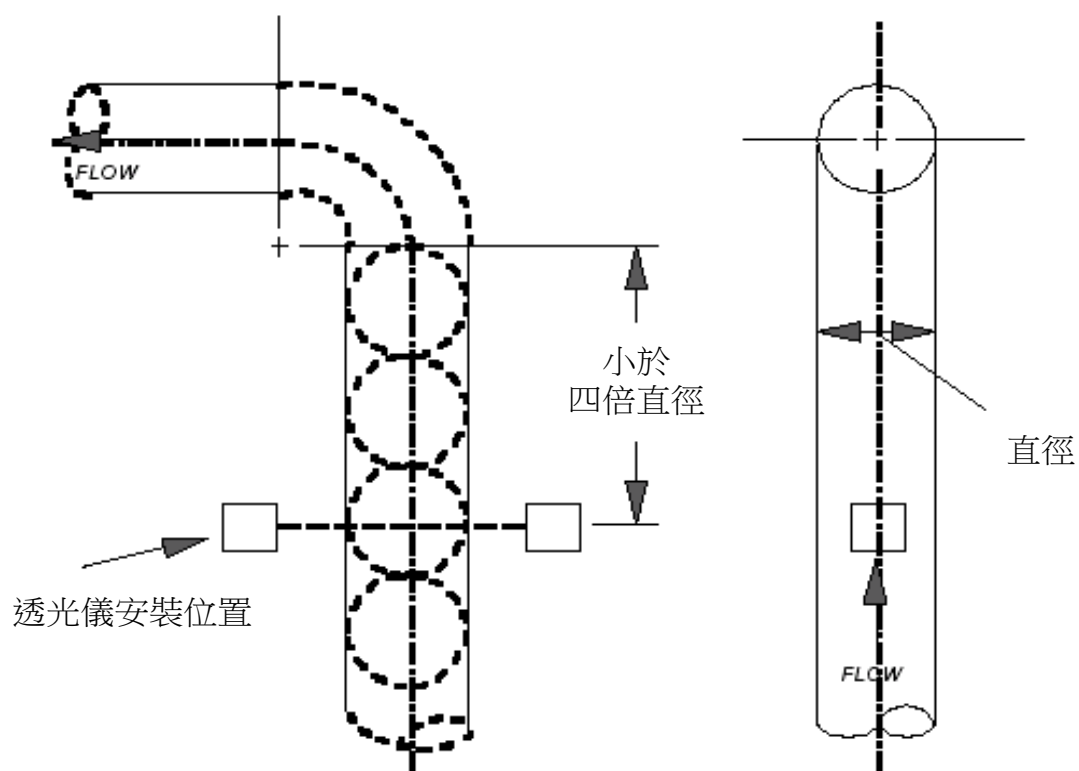
n：數據之組數。遺失數據或執行訊號平行比對之每季訊號採集

誤差測試期間之數據不納入組數計算

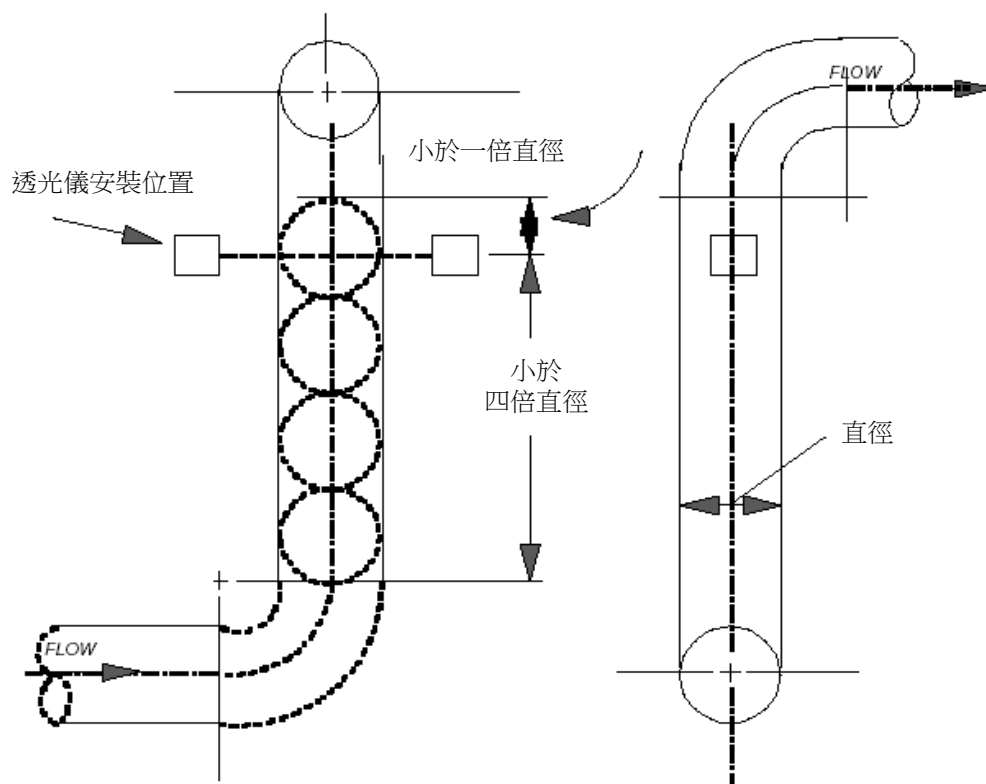
L<sub>i</sub>：各組數據之誤差百分比



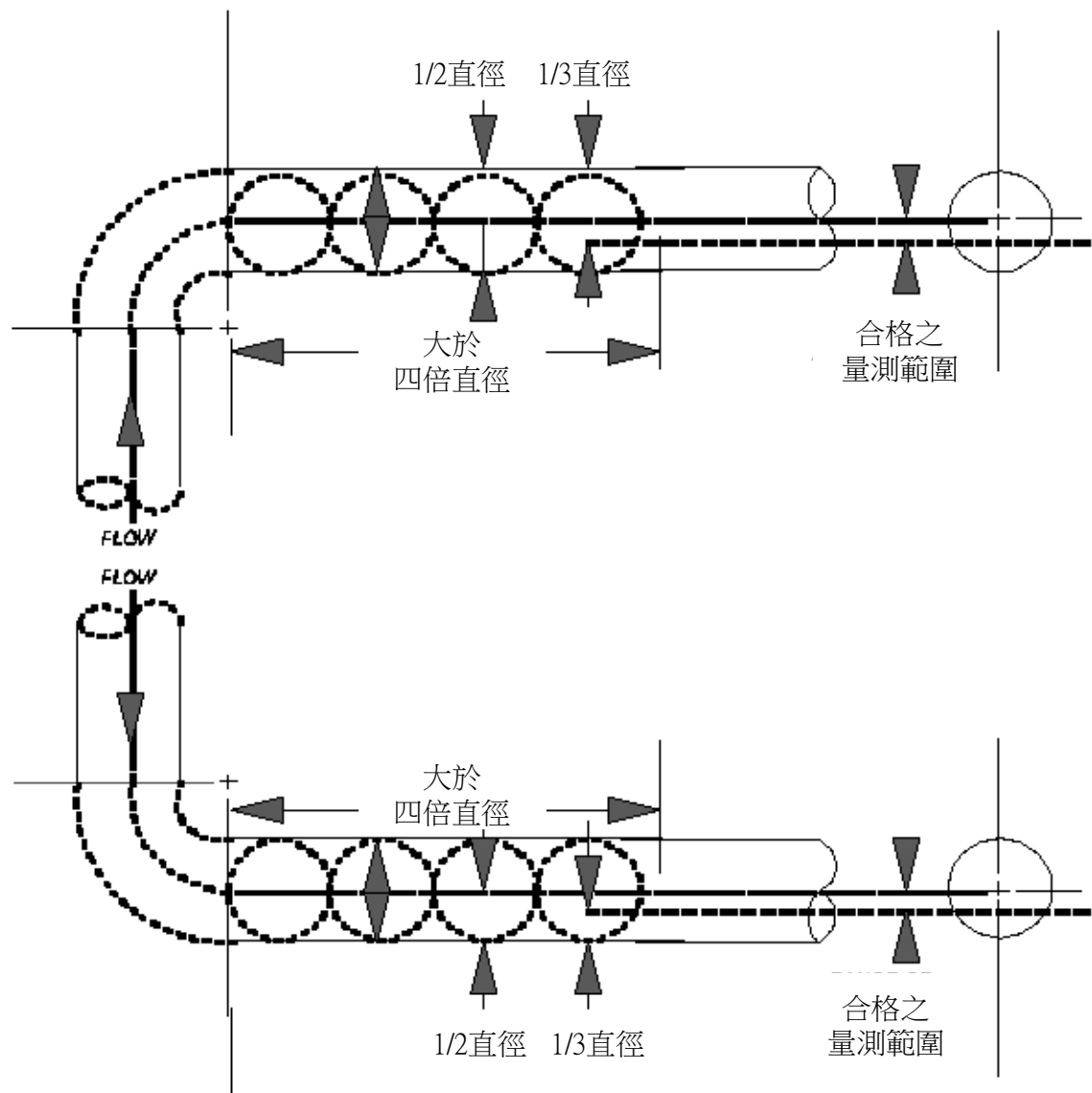
圖一、彎曲段下游垂直行向煙道安裝位置



圖二、彎曲段上游垂直行向煙道安裝位置



圖三、二彎曲段之間垂直流向煙道安裝位置



圖四、垂直彎曲段下游四倍直徑以外之水平煙道安裝位置